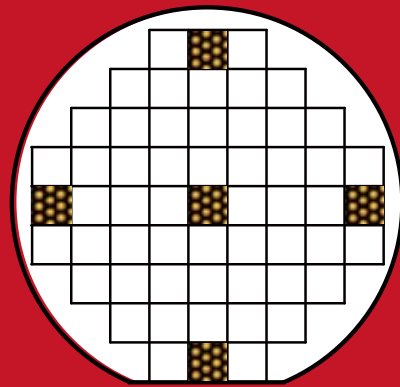


LED檢測專用之 原子力顯微鏡

PS-88 AFM

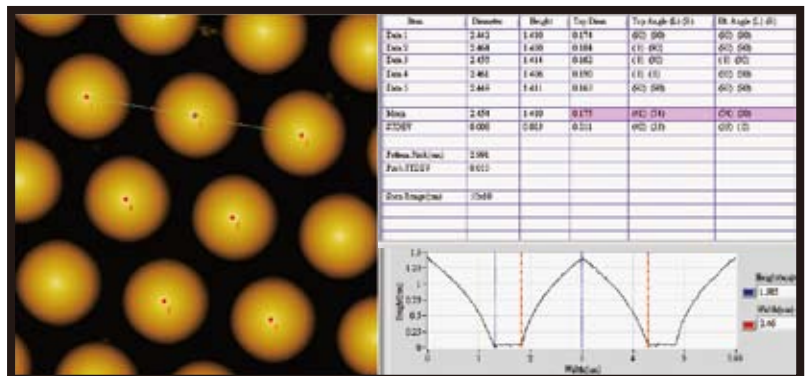
自有技術 來自台灣



使用者可自行決定單片量測點數與位置

性能表現 超乎想像

- 非破壞性檢測，檢測完可出貨。
- 突破傳統AFM速度極限，最快40秒獲得PSS數據。
- 突破光學檢測儀器極限，輕鬆量測2-1-1.6um之PSS結構。
- 高度數據重複性極高。
- 最適合量產線上使用之操作介面。
- 可自動量測所需高度、底寬、Pitch。
- 自動產生excel報表，減少人為量測誤差。
- 可自動完成多點量測，節省人力。
- 取放片方式：有cassette in/cassette out方式、萃盤方式、單片手動方式。

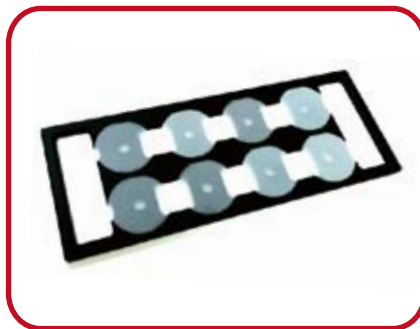


AFM Portfolio Information



手動單片版AFM

- 機台型號：PS-88 AFM
- 2/4吋共用。
 - 最經濟實惠的選擇。



八片萃盤版AFM

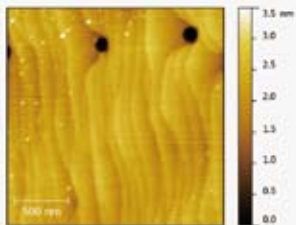
- 機台型號：PS-128 AFM
- 2吋wafer可放置8片。
 - 4吋wafer可放置2片。
 - 單批多片量測，省時省力。



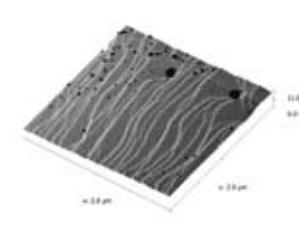
自動化robot版AFM

- 機台型號：PS-128R AFM
- cassette in/ cassette out 裝載方式。
 - 10組2/4吋共用之卡匣。
 - 自動機械手臂取放片，免除人工污染風險。
 - 可選配讀取雷射號功能。
 - 含sorting分級功能。
 - 真正適合量產線上使用。

磊晶後形貌

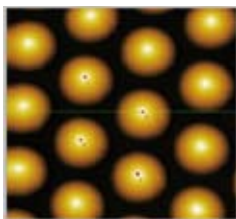


GaN Epi sample 2μm×2μm

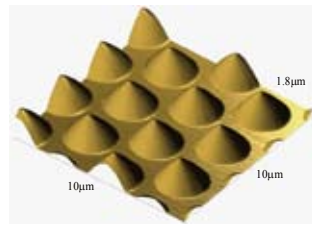


GaN Epi 3D 影像 2μm×2μm

乾蝕刻 PSS

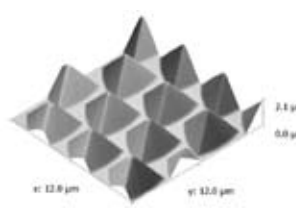


10μm×10μm

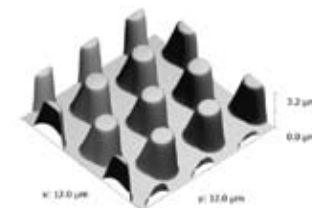


PSS 3D 影像 10μm×10μm

濕蝕刻與 PR 結構



濕蝕刻 3D 影像 10μm×10μm

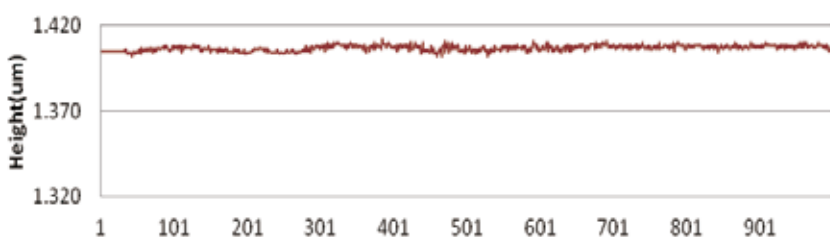


光阻 3D 影像 10μm×10μm

Specification

Sample Stage	for 2-inch /4-inch wafer
Scan Range(X/Y/Z)	15 μm/ 15 μm/ 15 μm
Imaging Throughput	≤ 80 seconds condition: (512 pixel) ² , (10 μm) ²
3σ Repeatability (400 measurements)	height: ≤ 5 nm
Probe Compatibility	all major manufacturers, including anti-wear and high-aspect-ratio probes
Auto PSS Measurement	Yes

連續掃描1000次之高度數據



1 σ = 0.0016μm 3 σ = 0.0049μm

Force Precision Instrument Co., Ltd

TEL +886 2 2655 7010 FAX +886 2 2655 7006
EMAIL service@fpic.com.tw
5F-3, Building G, NO.3-1, Park St., Nangang,

WWW.FPIC.COM.TW